

70-319

纯金属与合金中杂质元素氧化物  
粉末法的光谱定量分析操作手册

请  
交  
换

上海钢铁研究所

一九七二年七月

A decorative rectangular border with a repeating floral or scrollwork pattern surrounds the text.

→ 纯金属部分

三 合金部分

TG 115.4-52

(GT 21/2)

9 02

目 录



GT 21/21

一 纯金属部分

纯镍中杂质元素的光谱定量分析 ..... 1

纯铁中杂质元素的光谱定量分析 ..... 5

纯铁中铅、镉、锡、铋、砷、铜的光谱定量分析 ..... 11

金属钴中杂质元素的光谱定量分析 ..... 14

金属铜中杂质元素的光谱定量分析 ..... 18

金属铬中杂质元素的光谱定量分析 ..... 22

金属锰中杂质元素的光谱定量分析 ..... 25

钛及二氧化钛中杂质元素的光谱定量分析 ..... 29

金属钼、氧化钼中杂质元素的光谱定量分析 ..... 33

金属钨、氧化钨中杂质元素的光谱定量分析 ..... 35

金属锆、氧化锆中杂质元素的光谱定量分析 ..... 38

金属铌、氧化铌中杂质元素的光谱定量分析 ..... 42

金属钽、氧化钽中杂质元素的光谱定量分析 ..... 46

钒铁中铅、镉、锡、铋、砷、铜、锰、硅、铝的光谱  
定量分析 ..... 50

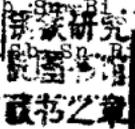
二 合金部分

钛合金中铁、硅、钙的光谱定量分析 ..... 54

镍基合金中硼的光谱定量分析 ..... 57

镍铬合金中 Pb, Sn, Sb, Bi, As 的光谱定量分析 ..... 59

镍钼铁合金中 Pb, Sn, Sb, Bi, As, Cu, Ca 的光谱定量  
分析 ..... 62



204317

镍钴铬钼铝合金中铅的光谱定量分析 .....	65
镍铁铬合金中Pb.Sb.Sn.Bi.As的光谱定量分析 ...	67
铁镍钴合金中Pb.Sb.Sn.Bi.As的光谱定量分析 ...	69
锰镍铬合金中镁、铝、铁、硅的光谱定量分析 .....	71
锰镍铬铁钴合金中铝、钛、硅的光谱定量分析 .....	73

附：

杂质元素标准溶液的配制 .....	76
常用金属和氧化物换算因数表 .....	80
显影液和定影液的配制 .....	81

## 土壤中杂质元素的光谱定量分析

### 一 分析样品的处理：

称取样品 2 克，置于磁蒸发皿中，加 1 : 1 HNO<sub>3</sub> 20ml，加热溶介，蒸干溶液后将磁蒸发皿在 700°C 马弗炉中灼烧 20 分钟，取出冷却并研碎均匀。将处理后的氧化物样品称 0.4 克压成  $\phi$  6mm 丸子放在有孔穴的石墨电极上进行摄谱。

### 二 工作条件：

1. 分析 Pb, Sb, Sn, Bi, As, Cu, Cd, Zn

ИСП-28 摄谱仪，三透镜光学系统，遮光板 5mm，狭缝 10 $\mu$ ，分析间隙 2.5~3mm。

光源：直流电弧光源（自制）电压 250V，电流 7A，阳极激发，无预热，曝光 60 秒（曝光时间从样品燃弧开始）

电极：上电极  $\phi$  3.5 $\times$ 10mm 半圆头石墨电极。

下电极直径 6mm 孔径 0.5mm 平底石墨电极。

感光板：ILFORD N30 置于 2300~2650 $\text{\AA}$  与 2750~2950 $\text{\AA}$  处。

FUJI PLATE（日本板）置于 3000~3400 $\text{\AA}$  处

显影：A + B 显影液，20°C  $\pm$  1°C，N30 显影 3 分钟，日本板显影 2 分钟。

2. 分析 Si, Co, Mn, Mg, Al, Fe。

ИСП-28 摄谱仪，三透镜光学系统，遮光板 5mm，狭缝 10 $\mu$ ，分析间隙 2.5~3mm。

光源：直流电弧光源（自制）电压 250V，电流 6A，阴极激发，预热 30 秒，曝光 30 秒。

电极：上电极同上，下电极用阳极激发后的溶珠连同电极一起进行阴极激发。

感光板：FUJI PLATE（日本干板）置于 2370~2580 $\text{\AA}$  与 2700~3150 $\text{\AA}$  处。

显影：A + B 显影液，20°C  $\pm$  1°C，显影时间 2 分钟。

### 三 测量与分析线：

用 D-2 测微光度计，测量狭缝 200 $\mu$ ，8 标尺，干板测量，采用三标准试样法，以  $\lg \left( \frac{I_A + D}{I_0} - 1 \right) \sim \lg C$  与  $\lg B \sim \lg C$  绘制工作曲线

分析线	背景扣除方向	内标线	分析范围
As 2349.84 $\text{\AA}$	短波方向	/	0.0003~0.03%
Cu 2492.2 $\text{\AA}$	"	"	0.001 ~0.1 %
Pb 2833.06 $\text{\AA}$	长波方向	"	0.0003~0.03%
Sn 2839.98 $\text{\AA}$	长波方向	"	0.0003~0.03%
Sb 2877.91 $\text{\AA}$	短波方向	"	"
$\Delta$ Sb 2598.05 $\text{\AA}$	"	"	0.003 ~0.03%
Bi 3067.71 $\text{\AA}$	长波方向	"	0.0003~0.03%
Cd 3261.0 $\text{\AA}$	短波方向	"	"
Zn 3345.6 $\text{\AA}$	长波方向	"	0.001 ~0.1 %
Co 2424.9 $\text{\AA}$	"	Ni 2489.5 $\text{\AA}$	0.001 ~0.1 %
Si 2516.11 $\text{\AA}$	短波方向	"	"
Fe 2488.14 $\text{\AA}$	长波方向	"	"
Mn 2794.81 $\text{\AA}$	短波方向	"	0.0003~0.03%
$\Delta$ Mg 2782.97 $\text{\AA}$	"	Ni 2834.55 $\text{\AA}$	0.003 ~0.1 %
Mg 2796.53 $\text{\AA}$	长波方向	"	0.001 ~0.03%
Al 3092.71 $\text{\AA}$	"	"	0.001 ~0.1 %

註： $\Delta$  液相含量时可采用之线对。

四 标准样品含量：

杂质元素	1	2	3	4	5
Pb, Sb, Sn, Bi, As Cd, Mn.	0.03%	0.01	0.003	0.001	0.0003
Al, Si, Co, Cu, Zn	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1
Mg, Fe	0.1	0.03	0.01	0.003	0.001

4. 标准样品的配制：

1. 称量样品以 10 克纯镍计算。

称取各号纯镍试样加 1 : 1  $HNO_3$  100ml 加热溶解，蒸干体积分别加入各杂质元素的标准溶液，热至糖浆状，分别加 20ml  $HNO_3$ ，以逐次离子（反复 2 ~ 3 次）蒸干后，放入马弗炉内，于 700°C 灼烧 30 分钟，取下冷却，研碎均匀备用。

2. 系质标准溶液的加入量：

标 样 号		1	2	3	4	5
杂质元素	杂质浓度	0.03%	0.01%	0.003%	0.001%	0.0003%
	Pb, Sb, Sn, Bi	3mL	1mL			
	As, Cd, Mn			3mL	1mL	
MS, Fe	0.01mg/mL					3mL
	5mg/mL	0.1	0.03	0.01	0.003	0.001
	1mg/mL	2mL				
Al, Si, Co Cu, Zn	0.1mg/mL					3mL
	5mg/mL					
	1mg/mL					
杂质总重量	0.1mg/mL	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1
	5mg/mL					2mL
基体总重量	1mg/mL			1mL	3mL	
	0.1mg/mL	1mL	3mL			
		38.5mg	13.5mg	8.8mg	15.8mg	50.38mg
		9.9615g	9.9865g	9.9912g	9.9842g	9.94962g

## 纯铁中杂质元素的光谱定量分析

### 一 分析样品的处理:

称取样品2克置于磁蒸发皿中,加入1:1 HNO<sub>3</sub> 20ml,在电热板上低温溶介(若不溶介可加入1~3ml HCl 使试样溶介之,这样就需加浓 HNO<sub>3</sub> 驱逐氯离子每次5ml,需2~3次)蒸干溶液后将磁蒸发皿在500°C马弗炉中灼烧20分钟,取出冷却并研磨均匀。

如果要分析 Nb 时,需要加入 2ml (2mg/ml) Zr 溶液作内标,并且赶 Cl<sup>-</sup> 3次。(样品以2克计算)将上述处理后的氧化物样品称0.35克压成Φ 6mm 片子放在有孔穴的石墨电极上进行摄谱。

### 二 工作条件:

#### 1. 分析 Pb, Sb, Sn, Si, As, Cu, Zn

МОН-28型摄谱仪,三透镜光学系统,遮光板5mm,狭缝10μ,分析间隙2.5~3mm。

光源:直流电弧光源(自制)电压250V,电流7A,阳极激发,无预热,曝光60秒(曝光时间从试样燃弧开始)

电极:上电极Φ 3.5×10mm 半圆头石墨电极。

下电极直径6mm孔深0.5mm 平底石墨电极。

感光板:ILFORD N30置于2280~2500Å,2780×2950Å与3200~3400Å处。

#### 2. 分析 Al, Cr, Mn, Si, Ti, V, Ni, Co

МОН-28型摄谱仪,三透镜光学系统,遮光板3.2mm。

狭缝10μ,分析间隙2.5~3mm。

光源:直流电弧光源(自制),电压250V,电流6A阳极激发,无预热,曝光30秒(曝光时间从试样燃弧开始)样品是用阳极激发后的熔珠来进行摄谱。

电极:同上

感光板:ILFORD N30置于2300~2500Å处

FUJI PLATE(日本干板)置于2500~2620与2750~3450Å处。

3. 分析 Nb, Ti, V, Cu, Co, Ni, Mn, Si, Al, Cr.

E-742 石英系统大型摄谱仪, 三透镜光学系统, 遮光板 7mm, 狭缝 9 $\mu$ , 分析间隙 2.5-3mm. 波段 2430-3450 $\text{\AA}$  处.

光源: FS-138 电容电弧, 电容 80 $\mu\text{f}$ , 电感 0.06mH, 电阻 (12 和 4 两挡), 电流 5 A 阴极激发, 无预热, 曝光 30 秒 (曝光时间从试样燃弧开始) 分析样品是用阳极激发后的熔珠来进行摄谱.

电极: 同上

感光版: ILFORD H30 置于 2800-3450 $\text{\AA}$  (感光板紧靠长波放一块 12Cm)

显影: A + B 显影液 20 $^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ , 显影时间: H30 显影 3 分钟, 日本干板显影 2 分钟.

三 测量与分析线:

用 M $\Phi$ -2 测微光度计, 测量狭缝 200 $\mu$ , 用 S 标尺, 干板测量以  $\log \frac{I_{\lambda} + \Phi}{I_{\Phi}} - 1$  ) ~  $\log C$  与  $\log R$  ~  $\log C$  绘制工作曲线, 以三标准试样法进行分析.

分析线 扣除背景方向 内标线 分析范围

Б-742

Bi2881.58Å	长波方向	Fe2883.73Å	0.003~0.3%
Mn2933.06Å	短波方向	"	"
Cr3014.91Å	长波方向跳过一条弱的Cr线	Fe3014.17	0.01~0.1%
Co3044.01Å	长波方向	"	0.01~0.3%
Ni3050.82Å	"	"	0.003~0.1%
Al3082.15Å	短波方向	Fe3014.17Å	0.01~0.1%
Nb3130.8 Å	3113.Å*附近	Zr3129.8Å	0.01~0.25%
V3185.4 Å	长波方向	Fe3014.17Å	0.003~0.1%
Cu3273.96Å	长波方向跳一条	"	0.003~0.03%
Ti3361.21Å	"	Zr3129.8Å	0.003~0.1%

ИСН-28

分析线	扣除背景方向	内标线	分析范围
Sb2311.46Å	短波方向	Fe2310.96Å	0.001~0.03%
As2349.84Å	短波方向	"	0.001~0.1%

802421.7Å	长波方向	0.001~0.03%
Fe2802.0Å	短波方向	"
B12897.97Å	Fe2901.9Å 长波方向	0.003~0.1%
Cu2824.36Å	Fe2828.81与Fe2827.89Å 之间	0.003~0.3%
Zn3345.57Å	Fe3355.102Å 长波方向	0.001~0.1%
Co2424.93Å	长波方向	0.01~0.3%
V2415.33Å	"	"
Mn2576.10Å	Fe2576.6与Fe2577Å 之间	0.03~0.3%
Mn2801.06Å	长波方向	Fe2883.73Å
Si2881.67Å	长波方向	0.003~0.03%
Al3082.16Å	Fe3083.74Å 长波方向	0.003~0.3%
Al2373.13Å	短波方向	"
Cr3014.76Å	Fe3012.45Å 长波方向	0.003~0.1%
Ni3050.82Å	长波方向	Fe2413.30Å
Ti3241.98Å	短波方向	0.01~0.3%
Ti3371.45Å	Fe3374.2 长波方向	0.01~0.3%
		Fe3153.20Å
		0.003~0.3%

44 标准样品的含量：

杂质元素	1	2	3	4	5
Pb.Sb.Sn.Bi.As.Zn	0.1	0.03	0.01	0.003	0.001
Si.Al.Co.Cr.Mn	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3
Co.Ti.V.Ni	0.3	0.1	0.03	0.01	0.003
Nb	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01

註：如果不要分析阳极元素时，将粉末试样装在 $\Phi 4 \times 5$  mm 平底石墨电极内，试样装前用自制直流电弧光源阳极激发烧成熔珠（ $E=250V$ ， $I=6A$ ，燃弧30秒）然后将烧成的熔珠倒出放在 $\Phi 3.5 \times 0.5$  mm 平底石墨电极上作阴极元素分析。

纯铁中杂质元素标准溶液的配制：

元 素	1	2	3	4	5
杂质浓度	0.1 %	0.03%	0.01%	0.003%	0.001%
Pb, Sb, Sn,	2 ml				
Bi, As, Zn	5 mg/ml	3 ml	1 ml		
	1 mg/ml			3 ml	1 ml
	0.1 mg/ml				
Si, Al, Cu,	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3
Cr, Mn	5 mg/ml			2 ml	6 ml
	1 mg/ml	1 ml	3 ml		
	0.1 mg/ml				
Co, Ti, V,	3 ml				
Bi,	0.3	0.1	0.03	0.01	0.003
	5 mg/ml	2 ml			
	1 mg/ml		3 ml	1 ml	
	0.1 mg/ml				3 ml
Nb	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01
	5 mg/ml	2 ml	1 ml		
	1 mg/ml			2.5 ml	1 ml
基 体 Fe	9.7994g	9.927 <sup>0</sup> g	9.927 <sup>0</sup> g	9.9417g	9.8472g

以上每只标准样品中，加入内标溶液液度 2mg/ml, 1.0ml, 基体是以 1.0 克计算。

## 纯铁中铅、锡、铜、铋、锑、铊的光谱定量分析

### 一 分析样品的处理：

称取样品1克置于蒸发皿中，加入1:1 HNO<sub>3</sub> 20ml在电加热板上低温溶介，蒸干溶液并移入马弗炉内600°C灼烧20分钟，取下冷却研磨待用。

将处理好的氧化物称0.15克压成直径6mm丸子。

### 二 工作条件：

ИСП-2型摄谱仪，三透镜光学系统，遮光板3.2mm，狭缝10μ，极距约2mm。

光源：直流电弧光源（自制）电压250V·电流5A阳极激发，曝光30秒，（曝光时间从样品燃弧开始）

电极：上电极φ3.5×10mm半圆头石墨电极。

下电极φ6×0.5有孔穴的平底石墨电极。

感光板：ILFORD E30置于2650~3000Å处。

显影：采用A+B显影液，20°C±1°C显影时间2分钟。

### 三 测量方法与分析线：

ИФ-2测微光度计，狭缝200μ，S标尺，干板测量，以ΔS~log C绘制工作曲线，以三标准试样法进行分析。

分析线	内标线	分析范围
Pb2663.16Å	Fe2828.81Å	0.05~0.5%
Sn2850.61Å	"	"
Cu2824.36Å	"	"
As2860.45Å	"	0.1~0.5%
Sb2877.91Å	"	0.05~0.5%
Bi2897.97Å	"	0.05~0.5%

### 四 标准样品的含量：

元素	1	2	3	4
Bb, Sn	0.50	0.25	0.10	0.05
Cu	0.05	0.1	0.25	0.50
Bi	0.10	0.05	0.50	0.25
As	0.10	0.50	0.25	0.05
Pb	0.05	0.25	0.10	0.50

註：As $2860.45\text{\AA}$  最低含量0.05% 其绝对黑度S为0.270，  
 采用 $\Delta S$  绘制工作曲线造成曲线弯曲，另外受P $2860.21\text{\AA}$  干扰，  
 故As的分析范围为0.1~0.5%。